X射线光电子能谱仪操作规程

一、仪器名称

AXIS Ultra DLD 型 X 射线光电子能谱仪(XPS), 日本岛津公司

二、仪器功能

X 射线光电子能谱仪可定性、定量测定固体物质表面除 H、He 以外的所有元素,并可进行元素价态分析。

三、操作指南

- 1. 操作仪器前,需详细阅读使用说明书,并经过专业培训。若实验过程中出现异常情况,及时联系本仪器管理人员。
- 2. 制备好样品,提前一天进样,抽真空一夜。
- 3. 打开电脑,开软件 Vision Manager-window-Manual window。在 X-ray 控制面板界面,单色化的 X 射线源: Al/Ag,常规为 l。选择 Al(mono),设置 Emission: 1 mA Anode, HT: 8 kV,点 Standby 等待一定时间预热 X-Ray,观察 Status 中 Filament 到 1.5 A 点 On 开启; 等待分步增加 AnodeHT: 10 kV,再分步将电流 Emission 增加至到需要,一般为 10 mA。每设置一步,点击一次回车键,系统自动增加。
- 4. 根据需要在 Neutraliser 控制界面,打开中和枪,按 On 键。
- 5. 根据软件中的"Real timedisplay"实时监控窗口中谱峰面积 Area 值的变化,方法一: 手动调节,调节各个坐标轴方向的按键(主要是 Z 轴)找到信号最强的位置。方法二: 自动调节,点击 Name- updateAuto-Z -Status -required -optimize 系统自动调节,然后点 update 更新位置。
- 6. 按需求选择宽扫(wide)-定性分析,窄扫(narrow)-化学价态分析。测试结束后取出样品,关闭软件,关闭电脑,关闭仪器。
- 7. 做好大型精密仪器设备的使用情况记录、实验器具归位。
- 8. 离开实验室前,做好清洁卫生工作,关好门窗,关闭电源。

四、注意事项

- 1. X 射线能谱仪对分析的样品有特殊的要求,在通常情况下只能对固体样品进行分析。
- 2. 关于样品: (1)块状样和薄膜样品,其长宽小于 10 mm,高度小于 5 mm。粉体样品可用双面胶带直接把粉体固定在样品台上,或者把粉体样品压成薄片后固定在样品台上。(2)含有挥发性物质的样品,在进入真空系统前必须清除掉挥发性物质。(3)表面有油等有机物污染的样品,在进入真空系统前必须清洗并自然干燥。(4)绝对禁止带有磁性的样品进入分析室。
- 3. 为了防止手直接接触,整个操作需戴手套,所用工具清洁防止试样交叉污染。